科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年 6月 5日現在

研究種目:基盤研究(B)
研究期間:2006~2008
課題番号:18360130
研究課題名(和文) テラヘルツ波による電気絶縁劣化診断技術の構築
研究課題名(英文) Development for the sensing technique of insulation degradation by THz wave.
研究代表者 吉村 昇 (Yoshimura Noboru) 秋田大学・学長 研究者番号:60006674

研究成果の概要:

本研究では小型かつ連続発振可能なテラヘルツ光源であるタンネットダイオードを用いたイ メージングシステムを用い,空間分解能および検出電圧の向上,さらにイメージングシステム の増設による測定時間の短縮と S/N 比の向上を図り, THz イメージングによる絶縁劣化現象の 検出を検討した.その結果,透過・反射イメージの同時取得と S/N 比の向上を可能にし,積層 基板内で発生したイオンマイグレーション現象の検出とポリエチレンシート内に生じた水トリ ーを検出できることを明らかにした.

交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2006 年度	9, 100, 000	2, 730, 000	11, 830, 000
2007 年度	3, 100, 000	930, 000	4, 030, 000
2008年度	2, 700, 000	810, 000	3, 510, 000
年度			
年度			
総計	14, 900, 000	4, 470, 000	19, 370, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:電気電子工学・電力工学・電気機器 キーワード:テラヘルツ,絶縁材料,絶縁劣化,電力工学,非破壊検査,イメージング

1. 研究開始当初の背景

THz 波はミリ波と遠赤外線の中間に位置 づけられる10¹¹から10¹³Hz までの周波数帯の 電磁波であり,近年まで利用することが出来 なかった未開拓の電磁波である。非電離放射 線であるTHz 波はX線と異なり材料へ及ぼす ダメージが少なく,生体に無害であるため特 別な防護施設を必要としない。物質にTHz を あてると原子間の振動が共振して電波が吸 収される。逆に吸収周波数から物質を構成す る分子の結合が分る。そのため,FTIR(フー リエ変換赤外分光光度計)で用いられる赤外 線と比べ、極めて高い精度で有機分子の構造 欠陥をも調べうる可能性を秘めている。

我々はこれまでに(財)半導体研究所で開 発されたTHzイメージング装置を用いて,可 視光線では診断が困難な皮膚ガンの一種で あるメラノーマの検査方法を研究してきた。 その際,生体組織に含まれる水分によりTHz 波が吸収されるため,水分を完全に除去する ためにホルマリン処理等の前処理が不可欠 であった。この経験を基に発想を逆転させ, 電力関連設備に必要不可欠な高分子材料中 に進入した僅かな水分が引き起こす絶縁劣 化現象の非破壊検査にTHz 波によるイメージ ング技術を応用するとの発想を得た。また, 劣化した絶縁材料および誘電体はTHz 帯での 電磁波吸収スペクトルに変化が生じると予 想され,劣化の程度も推定できると期待でき る。また,本研究課題で対象とするTHz 波に よる非破壊検査技術は多くの電気・電子機器 で使われているプリント配線板のイオンマ イグレーション等の劣化の評価にも応用で きると期待できる。

2. 研究の目的

本研究課題では THz 波による電気絶縁材 料および誘電体の非破壊検査技術を研究す る。

I. THz 波の応用:

①劣化過程で生成される各種水酸化物(水 トリー現象、イオンマイグレーション現 象)

②熱的に劣化する過程における高分子(ト ラッキング現象)

Ⅱ. イメージング技術の改良:

③透過

・反射測定技術の構築

④S/N 比向上のためのイメージングシステムの改良

特に、電力関連設備の CV ケーブルに利用 されている架橋ポリエチレン、電気機器等に 欠かせないプリント配線基板(FR4)等の誘 電体を対象として、絶縁劣化の非破壊検査技 術の実現をめざした。

3. 研究の方法

①THz イメージング装置の改良

イメージング装置は、TUNNETT 発振素子, パルス電源,SBD 検出器,ロックインアンプ, X-Z ステージおよびコンピュータで構成され ており,X-Zステージに取り付けられた試料 を走査することでTHz 波イメージを作成する。 なお、SBD 検出器の配置を換えることで透過 像と反射像を得ることができる。課題として, 透過像と反射像を同時に計測できないこと, 空間分解能が低いこと、THz 帯の電磁波によ るイメージング技術が発展途上にあるため 回折像等のノイズによりデータの解釈が難 しいこと等がある.そこで,透過反射像同時 計測技術の構築,空間分解能の向上,イメー ジング技術の構築をめざした.

②プリント配線板の絶縁劣化現象の非破壊 検査

PWB 内部に発生するイオンマイグレーションを検知するための基礎研究として、テラ ヘルツ波が高分子樹脂を透過しやすく金属 を透過しないという特性を生かし、プリント 基板の層間を伸展するデンドライト (dendrite)を検出できる可能性を検証した. 多層基板の層間に伸展するデンドライトを

テラヘルツ波により可視化できるかを調べ るために、フレキシブル基板を重ねることで 多層基板を模擬した試験基板を作製し、層間 において WDT(water drop test)法によりイ オンマイグレーションを発生させた. WDT 法は脱イオン水滴下法と呼ばれ、電極および 絶縁部分を脱イオン水で覆うため、湿度が 100%の結露した状態を模擬することができ、 電極金属の溶出,移行が加速され短時間でイ オンマイグレーションを発生させることが できる. イオンマイグレーションを発生させ た後、加えた水滴が完全に乾くまで、サンプ ルを空気中で自然乾燥させた.なお、テラへ ルツ波による透過画像の妥当性を評価する ために、本事業で新たに導入した軟X線顕微 鏡によるX線透過画像と、光学顕微鏡による 光学顕微鏡写真とを比較した.

③海底ケーブルの絶縁劣化現象の非破壊検 査

地中には多くの高経年 CV ケーブルが使用 されている. これらの CV ケーブルには絶縁 体の部分に有機高分子材料として架橋ポリ エチレンが使用されている。この CV ケーブ ルの周囲に水分が存在する条件下で、交流電 圧を印加し続けると絶縁体中に水分が侵入 し、樹枝状に凝縮する。この現象を水トリー と呼ぶ。水トリーは水を含む微小なボイドと それらを接続する細い線状のパスから構成 されていると考えられる。この微小ボイド内 の水が Maxwell 応力によって電界方向に引 っ張られ細い線状のパスに流入し、ボイド間 が電気的に接続されるため,水トリーを流れ る電流が急増する。絶縁体に水トリーが発生 することにより絶縁性能が大幅に低下し、絶 縁破壊事故が発生するという問題がある。こ のような問題を受け、架橋ポリエチレン内部 に発生した水トリーを検知することは非常 に重要なことであると考えられる。

水トリーの劣化診断方法としては,水トリ ー劣化による損失電流の高調波成分を,電気 信号として取得するなどの方法がある。この 方法により水トリー劣化を検出することは 可能であるが,実際の水トリーの大きさや形 状または分布などの可視情報を非破壊的に 得ることができず,絶縁体層を切断・スライ スして,可視化できる様に着色し,顕微鏡で 観察するという方法が必要となる。そこで本 研究では、この水トリーの分布や大きさなど を,水による吸収が顕著である THz 周波数 帯を利用することによって,その透過強度分 布から劣化試料を非破壊で直接観察するこ とを試みた。

4. 研究成果

①THz イメージング装置の改良

THz 波イメージング装置を用いて、生体組

織および各種絶縁材料試料へのテラヘルツ 波の入射角度の影響,アパーチャー,試料お よび SBD の相対距離が透過・反射波に及ぼす 影響を実験的に調べることで,試料をイメー ジングするために最適な計測条件を調べ,そ の一部を明らかにした。

THz 波イメージング装置の発信器である TUNNETT は、出力変動が1%以下で連続発振可 能と出力安定性が大きなメリットである。そ のため,他のレーザを使った THz イメージン グ装置と異なり、オープンループでの使用が 可能であり、イメージング装置全体の小型化 に貢献している。図1にTHz イメージング装 置による計測風景を示す。しかし、本研究で ターゲットとした微小な金属、水酸化物およ び水分を検出するとなると、イメージングシ ステムのS/N比をさらに向上させる必要があ ると考えた。また、本装置では THz 透過イメ ージングと反射イメージングでは装置の構 成が異なるため,同時に実施することはでき ていなかった。そこで、平成 19 年度は SBD 検出器および Lock in Amplifier をそれぞれ 1台増設し、入射する THz 波の強度をモニタ することで透過光と反射光の同時取得を可 能にし、装置の構成を変えることなく THz 透 過・反射同時イメージング装置への改良を実 施した。図2にTHz 透過・反射同時イメージ ング装置のブロック図を示す.これにより, X線顕微鏡では検出できないフレキシブル基 板間に発生させたデンドライトの反射・透過 一方, 画像を取得することが可能となった. 計測感度の向上を目指し,入力信号をリファ レンス信号としてサンプルの透過光を規格 化しようとしたところ,入力信号に未知の信 号が重畳しており、この実験系では引き込み 現象が発生していることを発見した。

THz 波の波長より短い 1.5mm 以下の小さな 物体を識別できるように、イメージング装置 の空間分解能の改良に取り組んだ。その過程 で,SBDの前段に近接場効果を利用した近接 場プローブを導入することを考案し、空間分 解能を向上できることを実験的に明らかに した.図3にナイフエッジ法により評価した プローブ型アンテナによる空間分解能を示 す. 透過量の変化から 0.5mm 以下の物体まで 識別できることを確認した。また,図4に, IC カードを対象としてイメージングした THz 波透過画像を示す. 同図(a)は標準構成のホ ーンアンテナによる測定結果,同図(b)はプ ローブ型アンテナの採用により改善された 測定結果を示す. 改良前は干渉により配線の 弁別が困難だったが,改良後には本来の太さ の配線を確認することが出来る.この結果は, 使用環境が制限される X線に代わり, 生体に 無害な THz 波を非破壊検査に応用できる可能 性を示している.



図1 THz 波によるイメージング風景



図2 反射透過同時計測可能な THz 波イメー ジング装置のブロック図





②プリント配線板の絶縁劣化現象の非破壊 検査

本研究で新たに構築したTHzイメージン グ技術を用いて非破壊的にイオンマイグレ ーション現象を検出するための条件を調べ、 本技術で検知可能な銅の析出量を調査した. THz波によるイメージングの妥当性を検 証・評価するために必要な参照データには, 本事業で新たに導入した軟X線顕微鏡によるX線吸収画像を利用した.

その結果, THz イメージングにより, デン ドライトを人工的に発生させた 10 枚のフレ キシブル基板において, 全てのデンドライト の存在を検知できることを実証した. 図5に 未劣化サンプル, 図6にイオンマイグレーシ ョン発生後のサンプル, 図7に水酸化銅析出 サンプルを示す.それぞれの図において(a) は軟X線による透過画像, 同図(b)は光学顕微 鏡による透過光画像, 同図(c)は THz 透過画 像を示す. 他の方式と比べて THz 透過画像 は空間分解能が低いが, デンドライトの有無 を明確に検知できることを確認できる.

THz 透過画像が軟 X 線により定量した銅 密度分布画像に近いことがわかり, THz 透過 画像によりイオンマイグレーション現象を 検出できる可能性が明らかにした.この結果 は被爆の危険により使用が制限されるX線に 代わり, 生体に無害な THz 波をイオンマイ グレーションの検出に利用できる可能性を 示唆している.しかしながら,空間分解能は X線に比べて劣るため,更なる技術開発が必 要と考えている.一方,銅密度分布画像から, アノードに近いデンドライト先端部に、より 多くの銅金属が蓄積している様子を確認し た.テラヘルツ透過画像と銅密度分布画像を 比較することで、本テラヘルツイメージング で検出可能な銅の最小密度が、約17.8µg/mm 2であることを明らかにした.

③海底ケーブルの絶縁劣化現象の非破壊検 査

海底用電力ケーブルの電気的絶縁劣化現象である水トリーの進行度をケーブル表面からの THz 光の反射・透過特性を調べることで検知可能かどうか応用研究を進めた.

非破壊検査用のサンプルとして、2.0mm厚 の架橋ポリエチレンシートに2kHz,18kVで 528時間課電することで人工的に約0.5mm長 の水トリーを発生させた.図8に水トリーが 発生したサンプルの外観を示す.図8におい て、青く示された部分はTHz波の透過量が少 なく、赤く示された部分はTHz波の透過量が 多いことを意味する.よって左半分(水トリ 一発生部)のTHz波の透過量が右半分(水ト リー未発生部)に比べて低下していることが わかる。これはTHz波が水トリーによって吸 収されたことが原因と考えられる。

図9に水トリーの発生の有無による THz 波 の透過量を比較したグラフを示す.水トリー 発生部分全体の THz 波の平均透過量は約 191 μV,未発生部では約 210 μV となった。水ト リー発生部分と,未発生部分の THz 波の平均



図7 水酸化銅が生成した配線板



図8 水トリー発生サンプルの THz 透過画像





透過量の差は約 19μV となり,水トリーによって THz 波が吸収され,透過が妨げられたと考えられる.よって,0.5mm 厚の劣化試料に対して,水トリー長が 0.3mm(60%)まで進展している場合,THz 波によって水トリー検出が可能であると考える.

一般に、テラヘルツ帯の電磁波は樹脂材料 を透過しやすく、金属材料で反射するため、 テラヘルツ透過・反射イメージングにより積 層プリント配線板の内部に発生するイオン マイグレーションの簡易検査も可能になる と期待できる.また、X線は人体への被爆の ため遮蔽された環境でなければ利用できな いが、テラヘルツ帯での電磁波は人体に無害 であるため、使用場所に制約がないとのメリ ットもある.一方、テラヘルツイメージング 技術の活用には、今後、テラヘルツ波発振器 の出力向上と共に空間分解能向上の技術開 発が不可欠と考える.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計10件)

- Zhang, H., <u>Mitobe, K</u>. and <u>Yoshimura,</u> <u>N.</u>, Application of Terahertz Imaging to Water Content Measurement, Japanese Journal of Application Physics, 有, Vol. 47, No. 10, 2008, pp. 8065-8070
- ② Zhang, H., <u>Mitobe, K. Suzuki, M.</u> and <u>Yoshimura, N.</u>, A New imaging method for the Cellulose Acetate Electrophoresis by the Terahertz Imaging, Japanese Journal of Application Physics, 有, printing now, 2009, printing now.
- ③ 水戸部一孝, 吉村昇, 三次元形状計測に よるイオンマイグレーションの評価, 電 気学会論文誌, 有, Vol. 127, No. 6, 2007, pp. 335-340.
- ④ 水戸部一孝,後藤真子,<u>吉村昇</u>,液中を成長するデンドライトの挙動に関する検討,静電気学会誌,有,Vol.31,No.5,2007, pp.205-206
- ⑤ カビール ムハムドゥル,水戸部 一孝, 佐藤 潤,玉本 英夫,<u>吉村 昇</u>,磁気式 モーションキャプチャにおけるレシー バ位置・角度のキャリブレーションの試 み,電気学会論文誌 C,有 Vol. 127, No. 1, 2007, pp. 88-89
- ⑥ 中井戸 宙・水戸部一孝・吉村 昇,イオ ンマイグレーション発生前の電極表面 に生じるナノスケールの兆候,平成 19 年電気学会全国大会講演論文集,無, Vol.2, 2007, p.37
- ⑦ 張 宏兵, 水戸部一孝, 吉村 昇, テラヘ

ルツによる植物の葉の水分含有量とイ メージングに関する研究,平成 19 年電 気学会全国大会講演論文集,無, Vol. 4, 2007, p. 299

- 水戸部一孝,辻 真,片寄喜久,小川純 一,<u>吉村 昇</u>,THz 波イメージングの空間 分解能向上に関する検討,平成 19 年電 気学会全国大会講演論文集,無,Vol.1, 2007, p.210
- ③ 後藤真子,水戸部一孝,吉村昇,液中を成長するデンドライトの挙動に関する検討,電気学会研究会資料,無, Vol. DEI-06,2006, pp. 17-20.
- <u>水戸部一孝</u>,藤原大輔,<u>吉村 昇</u>,微小 プローブを用いたイオンマイグレーシ ョンにおける液中抵抗値の測定,電気学 会研究会資料,無,Vol.DEI-06, 2006, pp.11-16.

〔学会発表〕(計 11 件)

- 勝間裕嗣,<u>水戸部一孝</u>,<u>鈴木雅史</u>, <u>吉村</u><u>昇</u>,イオンマイグレーション におけるデンドライトの伸展に及 ぼす液中抵抗に関する研究,電気学 会誘電絶縁材料研究会,2009年1月23 日,秋田市民交流プラザ
- 中野裕明,石川義博,水戸部一孝,鈴木 <u>雅史</u>, 吉村 昇, THz 波による水トリー 劣化試料の観察,電気学会誘電絶縁材料 研究会,2009 年 1 月 23 日,秋田市民 交流プラザ
- ③ 石川義博,水戸部一孝,鈴木雅史,吉村 昇
 ,THzイメージング装置の分解能向上,電
 子情報通信学会 2008総合大会,2008年3
 月19日,北九州市立大学
- ④ 勝間裕嗣,水戸部一孝,吉村昇,イオンマイグレーションにおけるデンドライトの伸展に及ぼす銅イオンの挙動に関する研究,平成20年電気学会全国大会,2008年3月19日,福岡工業大学
- ⑤ 中井戸 宙, 水戸部一孝, 吉村 昇,「イオンマイグレーション発生前の電極表面に生じるナノスケールの兆候」,平成19 年電気学会全国大会講演論文集, Vol.2, pp.37, 2007年3月15日 富山大学
- ⑥ 張 宏兵,<u>水戸部一孝</u>,<u>吉村 昇</u>,「テラ ヘルツによる植物の葉の水分含有量と イメージングに関する研究」, 報 19年 電気学会全国大会講演論文集, Vol. 4, pp. 299, 2007 年 3 月 15 日 富山大学
- ⑧ 後藤真子,<u>水戸部一孝</u>,<u>吉村昇</u>:液中を

成長するデンドライトの挙動に関する 検討,電気学会誘電絶縁材料研究会, DEI-06, pp.17-20 (2006) 平成18年9 月22日 秋田大学

- <u>水戸部一孝</u>,藤原大輔,<u>吉村 昇</u>「微小 プローブを用いたイオンマイグレーシ ョンにおける液中抵抗値の測定」, DEI-06, pp.11-16 平成18年9月22 日 秋田大学
- ⑩ 中井戸宙,<u>水戸部一孝</u>,<u>吉村昇</u>,「AFM を用いた環境試験法前後におけるPWB表 面形状の解析」,電気関連学会東北支部 大会,平成18年8月31日,秋田大学
- 長澤宏大,<u>水戸部一孝</u>,<u>吉村</u>昇,天 野憲一,三浦周平,「協会7号清酒酵母 に及ぼす低出カマイクロ波の非熱的効」, 電気関連学会東北支部大会,平成18年 8月31日,秋田大学

〔図書〕(計2件)

- 水戸部一孝他, JPCA 規格 プリント配線 板環境試験方法 JPCA-ET01~09-2007, 社団法人日本電子回路工業会, 2007 年
- ② <u>吉村昇</u>,<u>水戸部一孝</u>他,電気学会,プリント基板の試験と評価一イオンマイグレーション現象とその対策,オーム社,2007年

〔産業財産権〕

○出願状況(計1件)

発明者:<u>水戸部 一孝</u>,<u>吉村</u>昇,権利者: 秋田大学,特願 2006-040540,FIRアクテ ィブ・サーモグラフィ検査装置,2006年 2月17日,国内

○取得状況(計1件)
 発明者:水戸部 一孝, 吉村 昇, 権利者:
 秋田大学,特許公開2007-215809,
 FIRアクティブ・サーモグラフィ検査装置,2007年8月30日,国内

〔その他〕 ナシ

6.研究組織
(1)研究代表者
吉村 昇 (Yoshimura Noboru)
秋田大学・学長
研究者番号:60006674

(2)研究分担者
 鈴木 雅史(Suzuki Masafumi)
 秋田大学・工学資源学部・教授
 研究者番号: 60226553

水戸部 一孝 (Kazutaka Mitobe)秋田大学・工学資源学部・准教授研究者番号: 60282159

淀川 信一(Yodokawa Shinnichi)秋田大学・工学資源学部・助教研究者番号: 90282160

(3)連携研究者 ナシ